



# 改正 RoHS セミナー

平成  
31年

2月1日 金

会場

13:30-16:30 終了予定  
(受付開始 13:00)

八戸インテリジェントプラザ  
アイピーホール  
受講無料

## プログラム

- 開会あいさつ  
13:30-13:35 日本電子株式会社 石原 勝俊 氏
- 改正 RoHS 指令の概要及びPY/TD-GC/MSによるフタル酸エステル類のスクリーニング分析  
13:35-14:30 日本電子株式会社 小野寺 潤 氏
- 現場で使える蛍光X線装置の活用  
14:30-14:50 日本電子株式会社 衣笠 元気 氏

## 《休憩》

14:50-15:00

- FT-IRによるフタル酸エステル類の検査法  
15:00-15:30 日本分光株式会社 菅野 美幸 氏
- パイロライザーによるフタル酸エステル類のスクリーニング分析  
- 日常の操作とメンテナンス、結果の正確さ、高速分析の提案 -  
15:30-16:00 フロンティア・ラボ株式会社 鄭 甲志 氏
- 質疑応答とJSX-1000Sデモンストレーション  
16:00-16:30



日本電子製X線分析装置JSX-1000Sによる、分析をご希望の方は、**サンプル**をご持参下さい。

## 【お申込み・お問い合わせ先】

株式会社八戸インテリジェントプラザ  
八戸市北インター工業団地一丁目4番43号  
TEL0178-21-2111

※参加のお申し込みはメールでも受け付けております。  
hayashizaki@hachinohe-ip.co.jp までご連絡ください。



貴社（機関）名

(発信者氏名： TEL - )

申込締切 1/25

参加者	所属・氏名	E-mail	サンプル
			有 無
			有 無

FAX 0178-21-2119